

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Беспалов Владимир Александрович
Должность: Ректор МИЭТ
Дата подписания: 04.09.2023 11:05:08
Уникальный программный ключ:
ef5a4fe6ed0ffdf3f1a49d6ad1b49464dc1bf7354f736

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
И.Г. Игнатова
« 5 » *сентября* 2020 г.
М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Современные методы исследования материалов электронной техники»

Направление подготовки – 28.04.03 «Нanomатериалы»
Направленность (профиль) - «Инженерия наноматериалов для сенсорики»

2020 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательной программы:

Компетенции ОП	Подкомпетенция, формируемая в дисциплине	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</p>	<p>УК-1.СМИМЭТ Способен критически анализировать предоставленную информацию при рецензировании научной публикации</p>	<p>Знание правил написания рецензии на научную публикацию или аннотации к научной статье Умение критически анализировать предоставленную информацию по тематике образовательной программы при рецензировании научной публикации; подготовить развернутую аннотацию к научной публикации. Опыт рецензирования предоставленной информации для научной публикации</p>
<p>ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора</p>	<p>ОПК-1.СМИМЭТ Способен обоснованно выбирать методы исследования материалов и структур микро- и нанoeлектроники, обосновывать результаты</p>	<p>Знание основ электронной зондовой микроскопии; спектральных методов анализа; методов измерения геометрических параметров, основ международных стандартов оценки параметров материалов и структур. Умение выбрать наиболее подходящий метод исследования геометрических параметров и состава материалов и структур Опыт в решении практико-ориентированных задач по применению методов элементного анализа</p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Входные требования к дисциплине

Изучению модуля предшествует формирование компетенций в дисциплинах бакалавриата: «Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Физика» (Механика. Термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная физика) «Химия», «Кристаллография», «Метрология, стандартизация и технические измерения», «Технологии наноматериалов», «Физика и химия полупроводников», «Методы исследования наноматериалов и структур».

Данный модуль связан с модулем «Актуальные проблемы современной науки и техники». Формируемые в процессе изучения модуля компетенции в дальнейшем углубляются выполнением индивидуальных заданий НИР и практики и служат основой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс	Семестр	Общая трудоёмкость (ЗЕ)	Общая трудоёмкость (часы)	Контактная работа			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
				Лекции (часы)	Лабораторные работы (часы)	Практические занятия (часы)		
1	2	3	108	32	-	16	60	ЗаО

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ и наименование модуля	Контактная работа				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля
	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1. Специфика исследования материалов электронной техники. Международные стандарты контроля параметров материалов электронной техники	10	2	-		10	Контроль выполнения самостоятельной работы (ДЗ)

2.Спектральные методы анализа элементного состава материалов электронной техники	22	14	-	50	Контроль выполнения самостоятельной работы (ДЗ)
					Тестирование
					Контрольная работа

4.1. Лекционные занятия

№ модуля дисциплины	№ лекции	Объем занятий (часы)	Краткое содержание
1	1	2	Предмет, задачи, структура курса. Специфика исследования материалов электронной техники. Тенденции.
	2	2	Международные стандарты в области контроля кристаллографических параметров п.п. материалов и структур. Требования к современным методам исследования материалов ЭТ.
	3	2	Контроль геометрических параметров. Оптические методы.
	4	2	Профилометрия. Растровая микроскопия. Атомно-силовая микроскопия..
	5	2	Методы исследования морфологических дефектов и дефектов кристаллической решетки.
2	6	2	Обзор методов исследования химического состава материалов Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА). Детекторы с дисперсией по энергиям и длинам волн.
	7	2	Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия.
	8	2	Методы электронной спектроскопии. Электронная спектроскопия для химического анализа
	9	2	Электронная Оже - спектроскопия. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
	10	2	Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия
	11	2	Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов
	12	2	ИК—Фурье спектроскопия.
	13	2	Раман - спектроскопия
	14	2	Катодолюминесценция
	15	2	Методы ионной спектроскопии. Вторичная ионная масс – спектроскопия,
	16	2	Спектроскопия упруго рассеянных ионов Спектроскопия обратного

		резерфордовского рассеяния	Спектроскопия	резонансного резерфордовского рассеяния.
--	--	----------------------------	---------------	--

4.2. Практические занятия

№ модуля дисциплины	№ практического занятия	Объем занятий (часы)	Наименование занятия
1	1	2	Морфологические дефекты и дефекты кристаллической решетки. Составление атласа дефектов.
2	2	2	Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Расчет толщин экранов.
	3	2	Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА). Детекторы с дисперсией по энергиям и длинам волн.
	4	2	Практические задачи ЭОС
	5	2	Рецензирование научной публикации
	6	2	Решение комплексных задач по исследованию структуры и состава твердых тел
	7	2	ИК—Фурье спектроскопия.
	8	2	Анализ спектров и микрофотографий объектов для отработки способности делать научно-обоснованные выводы.

4.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов

№ модуля дисциплины	Объем занятий (часы)	Вид СРС
1	10	Изучение теоретического материала по тематике лекций 1 – 5 модуля 1. Изучение международных стандартов SEMI и ASTM по контролируемым параметрам пластин и полуфабрикатов для изготовления п.п. приборов и методов контроля. Подготовка конспекта и классификации методов. Подготовка к практическому занятию № 1.
2	10	Изучение теоретического материала по тематике лекций 6-7 модуля 2 и рекомендованной литературе. Подготовка к практическому занятию № 2, 3 модуля 2

10	Подготовка рецензии на научную публикацию (статью). Подготовка материалов к публичной защите рецензии (практическое занятие № 5 модуля 2).
10	Подготовка к прохождению рубежного контроля.
10	Изучение теоретического материала по тематике лекций 8 – 11 модуля 2. Подготовка к практическим занятиям № 4, 6 модуля 2
10	Изучение теоретического материала по тематике лекций 12-16 модуля 2. Подготовка к практическим занятиям № 7,8 модуля 2. Сбор и проведение анализа периодических изданий и информационных ресурсов по предложенной тематике.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе УМК дисциплины (ОРИОКС, URL: <http://orioks.miet.ru/>):

Модуль 1

Тема «Характеристика исследуемых объектов и излучений; физические эффекты, лежащие в основе методов исследования структуры»

По учебнику авторов Методы исследования состава и структуры материалов электронной техники [Текст] : Учеб. пособие. Ч. 2 : Методы исследования структуры материалов электронной техники / Л. И. Матына [и др.]; Под ред. Ю.Н. Коркишко изучить материал на стр. 4-32

По книге: Д. Брандон, У.Каплан «Мир материалов и технологий». «Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля».М.:Техносфера, 2004 изучить (повторить) материал на стр.39 – 59; 78 -82.

Модуль 1

Тема «Методы исследования морфологических дефектов и дефектов кристаллической решетки».

- ресурсы Интернет:

<http://www.dslib.net/tverdoteln-elektronika/issledovanie-rostovyh-defektov-upakovki-monokristallicheskogo-kremnija.html>

- литература:

Вавилов В.С. Дефекты в кремнии и на его поверхности [Текст] / В. С. Вавилов, В. Ф. Киселев, Б. Н. Мукашев. - М. : Наука, 1990

Модуль 1

Тема «Международные стандарты по методам исследования и контроля параметров материалов электронной техники»

- ресурсы Интернет:

<http://www.alterenergy.info/ngos/637-semi>

http://www.tech-e.ru/semi_26_08_2011.php

<http://www.neolabllc.ru/catalog/standart/01.htm>.

Модуль 2

Тема «Методы исследования структуры»

- ресурсы Интернет:

http://femto.com.ua/articles/part_2/4714.html

- литература

По учебнику Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : Учеб. пособие / Д. Брандон, У. Каплан; Пер. с англ. под ред. С.Л. Баженова, с доп. О.В. Егоровой. - М. : Техносфера, 2006. изучить материал на стр.123 – 138, стр.146 – 166; 171 – 174; 183-194.

Модуль 2

Тема «Методы элементного анализа»:

- литература:

Пул Ч. Нанотехнологии [Текст] : Учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс; Пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2009.

- Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст] : Учеб. пособие / Д. Брандон, У. Каплан; Пер. с англ. под ред. С.Л. Баженова, с доп. О.В. Егоровой. - М. : Техносфера, 2006 на стр. 253 - 269, 287 – 306.

Модуль 2.

- Методические указания студентам для подготовки рецензии на научную статью (ОРИОКС).

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература

1. Пул Ч. Нанотехнологии [Текст] : Учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс; Пер. с англ. под ред. Ю.И. Головина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Техносфера, 2009. - 336 с.

2. Гаврилов С.А. Учебное пособие по дисциплине "Физика и химия поверхности" [Текст] / С. А. Гаврилов, Д. Г. Громов; М-во образования и науки РФ, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2011. - 104 с.

3. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий [Текст] : В 2-х т. : [Учеб. пособие для вузов]. Т. 1 : Физико-химические основы технологии микроэлектроники / Ю. Д. Чистяков, Ю. П. Райнова; Под общ. ред. Ю.Н. Коркишко. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 392 с.

4. Введение в процессы интегральных микро- и нанотехнологий [Текст] : В 2-х т.: [Учеб. пособие для вузов]. Т. 2 : Технологические аспекты / М. В. Акуленок [и др.]; Под общ. ред. Ю.Н. Коркишко. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 256 с.

5. Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля [Текст]: Учеб. пособие / Д. Брандон, У. Каплан; Пер. с англ. под ред. С.Л. Баженова, с доп. О.В. Егоровой. - М. : Техносфера, 2006. - 384 с.

6. Методы исследования состава и структуры материалов электронной техники [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 1 : Методы исследования состава материалов электронной техники / Ю. Н. Коркишко [и др.]; Под ред. Ю.Н. Коркишко. - М. : МИЭТ, 1997. - 256 с.

7. Методы исследования состава и структуры материалов электронной техники [Текст]: Учеб. пособие. Ч. 2 : Методы исследования структуры материалов электронной техники / Л. И. Матына [и др.]; Под ред. Ю.Н. Коркишко. - М. : МИЭТ, 1997. - 120 с.

8 Матына Л.И. Основы световой, электронной и рентгеновской микроскопии [Текст]: Учеб. пособие по курсу "Методы исследования состава, структуры и электрофизических свойств материалов электронной техники" / Л. И. Матына. - М. : МИЭТ, 1998. - 104 с.

Периодические издания

1. Журнал «Известия вузов. Материалы электронной техники»
2. Журнал «Российские нанотехнологии».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. **SCOPUS: Библиографическая и реферативная база данных научной периодики:** сайт. – URL: www.scopus.com/ (дата обращения: 20.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей МИЭТ
2. **База American Chemical Society (ACS):** Некоммерческое научное издательство. – [Американское химическое общество, 2020.](http://pubs.acs.org) – URL: <http://pubs.acs.org> (дата обращения: 11.09.2020). – Режим доступа: свободный.
3. **Электронная версия базы данных ECS издательства Electrochemical Society:** Научное издательство IOP Publishing, 2020. – URL:<http://ecsd.org/> (дата обращения: 20.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
4. **Информационно-поисковая система Федерального института промышленной собственности:** сайт. - Москва, 2009-2019. – URL: <https://www1.fips.ru/iiss/> (дата обращения: 21.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
5. **База данных «Термодинамические константы веществ»** (химического факультета МГУ): сайт. – Москва, 1999-2020. – URL: <http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html/welcome.html> (дата обращения: 10.09.2020).
6. Сайт издательства «Грамота». - URL: <http://www.gramota.net/annotacia.html> -

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ходе реализации обучения используется смешанное обучение, основанное на интеграции технологий традиционного и электронного обучения, замещении части традиционных учебных форм занятий и самостоятельной работы студентов формами и видами взаимодействия преподавателей и обучающихся в электронной образовательной среде.

Для взаимодействия студентов с преподавателем используются сервисы обратной связи: электронная почта, платформа ZOOM, а также иные виды информационно-коммуникативных технологий сети Интернет, обеспечивающие оперативный канал связи преподавателя со студентом.

В процессе обучения при проведении занятий и для самостоятельной работы используются **внутренние электронные ресурсы** в форме тестирования в ОРИОКС.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Перечень программного обеспечения
Учебная аудитория	Компьютер с ПО и возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МИЭТ, беспроводная клавиатура + мышь , проектор.	ОС Microsoft Windows MS Office браузер
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ОРИОКС	Операционная система Windows от 7 версии; Пакет программ Microsoft Office; Браузер Acrobat reader DC Проигрыватель Windows Media

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ/ПОДКОМПЕТЕНЦИЙ

ФОС по подкомпетенции УК-1.СМИМЭТ Способен критически анализировать предоставленную информацию при рецензировании научной публикации

ФОС по подкомпетенции ОПК-1.СМИМЭТ Способен обоснованно выбирать методы исследования материалов и структур микро- и наноэлектроники, обосновывать результаты

Фонды оценочных средств представлены отдельными документами и размещены в составе УМК дисциплины в электронной информационной образовательной среде ОРИОКС // URL: <http://orioks.miet.ru/>.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1. Особенности организации процесса обучения

В рамках рассматриваемого курса предусмотрены следующие формы учебных занятий:

- *лекции*, цель которых состоит в формировании знаний путем рассмотрении теоретических вопросов дисциплины

- *практические занятия*, цель проведения которых – формирование умений путем выполнения практико-ориентированных заданий;

- *внеаудиторная самостоятельная работа*, цель которой – закрепление полученных знаний, подготовка к практическим занятиям, приобретение опыта самостоятельной работы с различными источниками информации.

Для успешного усвоения нового материала необходимо просматривать ранее пройденный материал по соответствующим предметам и разделам.

Для подготовки к практическим занятиям в библиотеке МИЭТ имеются учебно-методические пособия. Полезно воспользоваться учебно-методическим обеспечением для самостоятельной работы студентов в составе УМК дисциплины (ОРИОКС, URL: <http://orioks.miet.ru/>)

Выполнение индивидуального задания на СРС предполагает формирование у обучающихся подкомпетенций по индикаторам приобретения опыта деятельности. Для решения комплексной задачи и изучения материала модулей потребуется работа с периодическими изданиями, такими, как журнал «Известия вузов. Материалы электронной техники», журнал «Российские нанотехнологии» и др.

Контроль выполнения студентами индивидуального задания проводится на семинарах. Студенты выступают с докладом на семинаре, излагая содержание проделанной работы, анализируя различные аспекты освещаемой проблемы, происходит обсуждение информации в формате научной дискуссии.

Подготовкой портфолио необходимо начать заниматься с первых дней семестра, не устремляясь от активного участия во всех видах занятий.

Студентам рекомендуется регулярно посещать предусмотренные расписанием консультации с преподавателем.

11.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопительная система (НБС).

Баллами оцениваются: выполнение каждого контрольного мероприятия в семестре (в сумме 50 баллов) и сдача дифзачета (в сумме 50 баллов).

По сумме баллов выставляется итоговая оценка по предмету.

Структура и график контрольных мероприятий доступны в ОРИОКС // URL: <http://orioks.miet.ru/>).

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент Института ПМТ, к.т.н. , доцент _____



Матына Л.И.

Рабочая программа дисциплины «Современные методы исследования материалов электронной техники» по направлению подготовки 28.04.03 «Наноматериалы», направленности (профилю) «Инженерия наноматериалов для сенсорики» разработана в Институте перспективных материалов и технологий и утверждена на заседании Ученого совета Института ПМТ 30 сентября 2020 года, протокол № 39

Зам. директора Института


_____/А.В.Железнякова/

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа согласована с Центром подготовки к аккредитации и независимой оценки качества

Начальник АНОК


_____/И.М.Никулина /

Рабочая программа согласована с библиотекой МИЭТ

Директор библиотеки


_____/Т.П.Филиппова/